

Christine Baumgart
 Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
 Institute of Ion Beam Physics and Materials Research
 Department FWIM
 Postfach 51 01 19
 01314 Dresden


Phone: +49 351 260 2449
 Fax : +49 351 260 3285
 Email: C.Baumgart@fzd.de



LEBENS LAUF

	18.07.1982	In Berlin - Friedrichshain geboren
Schulbildung	09.1989 – 09.1995	Arthur-Hertz-Grundschule in Fredersdorf bei Berlin
	09.1995 – 06.2002	Einstein-Gymnasium in Neuenhagen bei Berlin; 29.06.2002 Erwerb der allgemeinen Hochschulreife mit der Durchschnittsnote 1,6
Studium	10.2002	Beginn des Studiums der Physik an der TU Dresden;
	04.2004 – 07.2004	Teilnahme am Lehrgang „Grundlagen der Vakuumphysik und -technik“
	09.2004	Vordiplom an der TU Dresden
	28.02.05 – 04.03.05	Teilnahme am Lehrgang „Rasterelektronenmikroskopie und Mikrobereichsanalyse“
	01.2006 – 03.2007	Anstellung als studentische Hilfskraft im Forschungszentrum Dresden- Rossendorf zur „Mitarbeit an Experimenten zur Schichtabscheidung von kubischem Bornitrid“
	03.2007	Diplomprüfungen, Durchschnittsnote: 1,8
	01.04.07 – 31.03.08	Diplomarbeit im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf zum Thema „Growth and characterization of SiO ₂ /Ag nanocomposites“
	25.03.2008	Erlangung des akademischen Grades Diplom-Physiker
	seit 14.04.2008	Doktorarbeit im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf zum Thema „Quantitative dopant profiling on doped semiconductors with Kelvin probe force microscopy“
	seit 06.2008	Öffentlichkeitsarbeit: Führungen für Besuchergruppen durch das Ionenstrahlzentrum Dresden-Rossendorf

Dresden, den 25.03.2010


 Christine Baumgart

Publikationen

Quantitative dopant profiling in semiconductors: A Kelvin probe force microscopy model

C. Baumgart, M. Helm, H. Schmidt, Phys. Rev. B **80** (2009) 085305.

Mikroskopische Aufnahmen neu gedeutet - Revolution in der Raster-Kelvin-Mikroskopie?

C. Baumgart, H. Schmidt, GIT Labor-Fachzeitschrift **53** (2009), 680.

Quantitative Electrical Nanometrology - Kelvin Probe Force Microscopy Measurements on Semiconductors

C. Baumgart, S. Streit, M. Helm, H. Schmidt, **invited article**, <http://www.imaging-git.com>, (2009).

Quantitative Kelvin probe force microscopy

C. Baumgart, M. Helm, H. Schmidt, Conference Proceedings MRS Fall Meeting Boston, 30th November – 4th December 2009, USA, in press.

Kelvin probe digs deep

C. Baumgart, TRAC Trends in Analytical Chemistry **28** (2009) vi-viii.

Konferenzen

Kelvin probe force microscopy imaging of cross-sections of Si multilayer structures

C. Baumgart, A.-D. Müller, F. Müller, M. Helm, A. Möller, H. Schmidt, Talk **HL 14.2**, DPG Spring Meeting, Dresden, March 22-27, 2009, Germany

Kelvin probe force and scanning capacitance microscopy on MOS structures

C. Baumgart, S. Jaensch, M. Helm, H. Schmidt, Poster **HL 48.88**, DPG Spring Meeting, Dresden, March 22-27, 2009, Germany

Frequency dependent Kelvin probe force microscopy on locally doped Si

C. Baumgart, M. Helm, H. Schmidt, Poster **OO 7.2**, MRS Fall Meeting Boston, 30.11.-04.12.2009, Boston, MA, USA

Quantitative Kelvin probe force microscopy imaging on locally doped Si

C. Baumgart, A.-D. Müller, F. Müller, M. Helm, H. Schmidt, Poster **O 60.12**, DPG Spring Meeting, Regensburg, March 21-26, 2010, Germany

Quantitative Kelvin probe force microscopy imaging on locally doped Si

C. Baumgart, A.-D. Müller, F. Müller, M. Helm, H. Schmidt, Talk **ID95**, Nanocoatings 2010, Dresden, March 28-31, 2010, Germany & Chairwoman der Session *Characterization I*

Frequency dependence in KPFM and C(V)-measurements on semiconductors

A.-D. Müller, C. Baumgart, H. Schmidt, F. Müller, Talk **TuE-S1057**, 12th International Scanning Probe Microscopy Conference, Sapporo, May 10-12, 2010, Japan

Quantitative Kelvin probe force microscopy on semiconductors under ambient conditions

C. Baumgart, A.-D. Müller, F. Müller, M. Helm, H. Schmidt, Talk, Nanofair2010, July 6-7, 2010, Dresden, Germany